

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination ELBOIM, YARON	
10/611,796		
Examiner	Art Unit	
Harold Kim	2181	

	SEAR	CHED	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Class	Subclass	Date	Examiner
710	29, 52, 57, 58, 60	4/27/2006	НК
		-	
		_	
			- "

INTERFERENCE SEARCHED					
Subclass	Date	Examiner			
	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
USPAT, USPGPUB, JPO, EPO, IEEE, NPL, PLUS, inventor search on eDan	4/27/2006	нк		
·				
	ı			
<u>.</u>				

Hould & 4/21/06